

名称：河北中电科航检测技术服务有限公司

地址：河北省石家庄市鹿泉区经济开发区石柏南大街 179 号

注册号：CNAS L11884

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2020 年 05 月 07 日 截止日期：2025 年 01 月 10 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项 目 / 参 数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
未分组						
1	军用设备	1	高温试验	《军用设备环境试验方法》 GJB150. 3-1986	只测： 容积≤15m³ 温度范围：常 温～+150℃； 针对特定用户、 特定产品	2020-05-07
				《军用装备实验室环境试验方法》 第 3 部分 高温试验 GJB150. 3A-2009	只测：容积≤15m³ 温度范围：常 温～+150℃；	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 1 页 共 45 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会	《军用通信设备通用规范》 GJB 367A-2001 A02	只测： 容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +150^\circ\text{C}$	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB1621.7A-2006 4.3	只测： 容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +150^\circ\text{C}$	2020-05-07
				《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.1	只测： 容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +150^\circ\text{C}$	2020-05-07
		2	低温试验	《军用设备环境试验方法 低温试验》 GJB 150.4-1986	只测：容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围： -65°C ～常温；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.4A-2009	只测：容积 $\leq 15\text{m}^3$ ，温度范围： -65°C ～常温；	2020-05-07
				《军用通信设备通用规范》 GJB 367A-2001 方法 A01	只测：容积 $\leq 15\text{m}^3$ ，温度范围： -65°C ～常温	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7-2006 4.2	只测：容积 $\leq 15\text{m}^3$ ，温度范围： -65°C ～常温	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	温度冲击试验	《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.4	只测：容积 $\leq 15\text{m}^3$ ，温度范围：-65℃~常温	2020-05-07
				《军用设备环境试验方法》 GJB 150.5-1986	只测：容积 $\leq 1\text{m}^3$ ，温度范围：-65℃~+150℃；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.5A-2009	只测：容积 $\leq 1\text{m}^3$ ，温度范围：-65℃~+150℃	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7-2006 4.6	只测：容积 $\leq 0.35\text{m}^3$ ，温度范围：-60℃~+200℃，转换时间 $< 5\text{min}$ ；	2020-05-07
		4	耐湿试验	《军用通信设备通用规范》 GJB 367A-2001 A07	只测：容积 $\leq 3.3\text{m}^3$ ，温度范围：常温~+85℃，湿度范围：（50%~95%）RH；	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7-2006 4.12	只测：容积 $\leq 15\text{m}^3$ ，温度范围：常温~+85℃，湿度	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 3 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	稳态湿热	《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.3	范围：（50%～95%）RH 只测：容积≤15m ³ 温度范围：常温～+85℃ 湿度范围：（50%～95%）RH	2020-05-07
				《军用设备环境试验方法》 GJB 150.9-1986	只测：容积≤3.3m ³ 温度范围：常温～+85℃ 湿度范围：（50%～95%）RH； 针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.9A-2009	只测：容积≤15m ³ 温度范围：常温～+85℃ 湿度范围：（50%～95%）RH；	2020-05-07
		6	盐雾试验	《军用设备环境试验方法》 GJB 150.11-1986	只测：容积≤1.2m ³ ； 温度范围：35	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		$^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; 盐雾沉降量: (1~3) ml/80cm ² ·h 针对特定用户、特定产品	
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.11A-2009	只测：容积 \leq 1.2m ³ ；温度范围：35 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; 盐雾沉降量: (1~3) ml/80cm ² ·h	2020-05-07
				《军用通信设备通用规范》 GJB 367A-2001	只测：常用一般环境试验方法（补充件） 3.10.2.14；容积 \leq 1.2m ³ ；温度范围：35 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; 盐雾沉降量: (1~3) ml/80cm ² ·h	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7-2006 4.16	只测：容积 \leq 1.2m ³ ；温度范围：35 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; 	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.9	盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h	
				《地空导弹制导雷达通用规范》 GJB 2783A-2006 3.7.12	只测：容积≤ 1.2m ³ ； 温度范围：35℃±2℃； 盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h	2020-05-07
		7	淋雨试验	《军用设备环境试验方法》 GJB 150.8-1986	只测：程序 I、III； 容积：Φ1000mm； 最大载重：100kg； 水平风速：≤18m/s； 降雨强度：100mm/h； 针对特定用户、特定产品	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 6 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.8A-2009	只测：容积：Φ1000mm；最大载重：100kg；水平风速：≤18m/s；降雨强度：100mm/h	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7A-2006 4.14	只测：容积：Φ1000mm；最大载重：100kg；水平风速：≤18m/s；降雨强度：100mm/h	2020-05-07
				《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.11	只测：容积：Φ1000mm；最大载重：100kg；水平风速：≤18m/s；降雨强度：100mm/h	2020-05-07
				《地空导弹制导雷达通用规范》 GJB 2783A-2006 3.7.7	只测：容积：Φ1000mm；最大载重：100kg；水平风速：≤18m/s；降雨强度：100mm/h	2020-05-07
		8	太阳辐射试验	《军用设备环境试验方法》 GJB 150.7-1986	只测：程序 I 容积≤3.6m³；辐	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.7A-2009	照强度 $\leq 1120\text{W}/\text{m}^2$ 针对特定用户、特定产品 只测：方法程序 I 容积 $\leq 3.6\text{m}^3$ ；辐照强度 $\leq 1120\text{W}/\text{m}^2$	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7A-2006 4.7	只测：容积 $\leq 3.6\text{m}^3$ ；辐照强度 $\leq 1120\text{W}/\text{m}^2$	2020-05-07
				《环境试验 第2部分 试验方法 试验 Sa 模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》 GJB2423.24-2013	只测：容积 $\leq 3.6\text{m}^3$ ；辐照强度 $\leq 1120\text{W}/\text{m}^2$	2020-05-07
				《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.12	只测：容积 $\leq 3.6\text{m}^3$ ；辐照强度 $\leq 1120\text{W}/\text{m}^2$	2020-05-07
				《地空导弹制导雷达通用规范》 GJB 2783A-2006 3.7.14	只测：容积 $\leq 3.6\text{m}^3$ ；辐照强度 $\leq 1120\text{W}/\text{m}^2$	2020-05-07
		9	振动试验	《军用设备环境试验方法》 GJB 150.16-1986	只测：最大推力：1000kN；最大加速度： $500\text{m}/\text{s}^2$ ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz~	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 8 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.16A-2009	2000Hz; 针对特定用户、特定产品 只测：最大推力：1000kN；最大加速度： 500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	2020-05-07
				《军用通信设备通用规范》 GJB 367A-2001 A05	只测：最大推力：1000kN；最大加速度： 500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7A-2006 4.11	只测：最大推力：1000kN；最大加速度： 500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 9 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.6		2000Hz	
					只测：最大推力：1000kN；最大加速度：500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	2020-05-07
					只测：最大推力：1000kN；最大加速度：500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	2020-05-07
		10	霉菌试验	《军用设备环境试验方法》 GJB 150.10-1986	针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.10A-2009		2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7-2006 4.15		2020-05-07
				《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.8		2020-05-07



No. CNAS L11884

第 10 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《地空导弹制导雷达通用规范》 GJB 2783A-2006 3.7.11		2020-05-07
		11	冲击	《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.18A-2009	只测：方法程序 I 最大推力：500kN；最大加速度：5000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.5~11）ms；	2020-05-07
				《军用设备环境试验方法》 GJB 150.18-1986	只测：最大推力：500kN；最大加速度：5000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.5~11）ms；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7A-2006 4.10	只测：试验条件 A、B、最大推力：500kN；半正弦：峰值最大加速度：30000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.3~11）ms；后峰锯齿波：峰值最大加速度：1000m/s ² ；脉冲持续时	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 11 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					间：（6~18）ms	
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.5	只测：试验条件A、B、最大推力：500kN；半正弦：峰值最大加速度：30000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.3~11）ms；后峰锯齿波：峰值最大加速度：1000m/s ² ；脉冲持续时间：（6~18）ms	2020-05-07
				《地空导弹制导雷达通用规范》 GJB 2783A-2006 3.7.10	只测：试验条件A、B、最大推力：500kN；半正弦：峰值最大加速度：30000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.3~11）ms；后峰锯齿波：峰值最大加速度：1000m/s ² ；脉冲持续时间：（6~18）ms	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 12 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	冲击响应谱	《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.18A-2009	只测：最大推力：500kN；最大加速度：100000m/s ² ；响应谱频率范围：10-6000Hz；	2020-05-07
		13	可靠性试验方法	《军用通信设备通用规范》 GJB 367A-2001	只测：方法 B.3.4、B.3.5 容积≤3.3m ³ 温度范围：-65℃~+150℃湿度范围：20%RH~95%RH 最大推力：50kN 最大负载：100kg 最大位移：76mm 最大速度：2.0m/s 频率范围：（5~2000）Hz	2020-05-07
		14	综合试验	《可靠性鉴定和验收试验》 GJB 899A-2009	只测：附录 B3 容积≤3.3m ³ 温度范围：-65℃~+150℃湿度范围：20%RH~95%RH	2020-05-07
		15	环境应力筛选	《电子产品环境应力筛选方法》 GJB 1032-1990 方法 5	只测：容积：≤3.3m ³ ，温度范	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 13 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	围：-65℃~+150℃，湿度范围：（20%~95%）RH，最大温变速率：10℃/min，最大正弦推力：50kN，最大负载：100kg，，最大位移：76mm，最大速度：2.0m/s，频率范围：（5~2000）Hz	
		16	热真空	《运载器、上面级和航天器的试验条件》 GJB 1027A-2005 6.1.4, 6.2.9	只测：温度范围：-70℃~120℃，真空度：常压~5×10 ⁻⁵ Pa	2020-05-07
		17	低气压试验	《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7A-2006 4.4	只测：Φ1000mm×1200mm，压力范围：常压~1000Pa（常温）	2020-05-07
				《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.2	只测：Φ1000mm×1200mm，压力范围：常压~1000Pa（常温）	2020-05-07
				《地空导弹制导雷达通用规范》 GJB 2783A-2006 3.7.8	只测：Φ1000mm×1200mm，压力	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					范围：常压～1000Pa（常温）	
		18	砂尘试验	<p>中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件</p> <p>《军用设备环境试验方法》 GJB 150.10-1986</p>	只测： 容积：≤1m³； 温度：20℃～80℃； 风速：0.5m/s～18m/s； 吹砂浓度： 0.18g/m³～2.2g/m³； 吹尘浓度： 10.6g/m³±7.0g/m³；针对特定客户、特定产品	2020-05-07
				《军用装备实验室环境试验方法》 GJB 150.12A-2009	只测： 容积：≤1m³； 温度：20℃～80℃； 风速：0.5m/s～18m/s； 吹砂浓度： 0.18g/m³～2.2g/m³； 吹尘浓度：	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 15 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					10.6g/m ³ ± 7.0g/m ³	
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 《技术侦察装备通用技术要求 第七部分：环境适应性要求和试验方法》 GJB 1621.7-2006 4.17	只测： 容积：≤1m ³ ； 温度：20℃~80℃； 风速：0.5m/s~18m/s； 吹砂浓度： 0.18g/m ³ ~2.2g/m ³ ； 吹尘浓度： 10.6g/m ³ ± 7.0g/m ³	2020-05-07
				《军用地面雷达通用规范》 GJB 74A-1998 4.7.12.10	只测： 容积：≤1m ³ ； 温度：20℃~80℃； 风速：0.5m/s~18m/s； 吹砂浓度： 0.18g/m ³ ~2.2g/m ³ ； 吹尘浓度： 10.6g/m ³ ± 7.0g/m ³	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 16 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 《地空导弹制导雷达通用规范》 GJB 2783A-2006 3.7.13	只测： 容积： $\leq 1\text{m}^3$ ； 温度： $20^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ ； 风速： $0.5\text{m/s} \sim 18\text{m/s}$ ； 吹砂浓度： $0.18\text{g/m}^3 \sim 2.2\text{g/m}^3$ ； 吹尘浓度： $10.6\text{g/m}^3 \pm 7.0\text{g/m}^3$	2020-05-07
2	电子电气产品及元器件	1	高温试验	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 108 高温寿命试验	只测： 容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +150^\circ\text{C}$ ； 针对特定用户、 特定产品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 108 高温寿命试验	只测：容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +150^\circ\text{C}$ ；	2020-05-07
				《电工电子产品环境试验》 GB/T 2423.2-2008	只测： 容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +150^\circ\text{C}$ ；	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 1031	只测：容积 \leq	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 1005.1	0.2m ³ ，温度范围：+60℃～+200℃ 只测：条件 A 容积≤15m ³ ，温度范围：常温～+150℃	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 1005 条件 A	只测：容积≤15m ³ ，温度范围：常温～+150℃ 针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《过载传感器通用规范》 GJB5440-2005 3.5.1	只测：容积≤15m ³ 温度范围：常温～+150℃	2020-05-07
		2	低温试验	《电工电子产品环境试验》 GB/T 2423.1-2008	只测：容积≤15m ³ 温度范围：-65℃～常温	2020-05-07
				《过载传感器通用规范》 GJB5440-2005 3.5.2	只测：容积≤15m ³ ，温度范围：-65℃～常温	2020-05-07
		3	温度冲击试验	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 107 温度冲击试验	只测：容积≤0.35m ³ 温度范围：-60	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	℃~+200℃ 转换时间<5min; 针对特定用户、特定产品	
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 107 温度冲击试验	只测：条件 A、B、C、F 容积≤0.35m³ 温度范围：-60℃~+200℃ 转换时间<5min;	2020-05-07
				《过载传感器通用规范》 GJB5440-2005 3.5.3	只测： 容积≤0.35m³ 温度范围：-60℃~+200℃ 转换时间<5min;	2020-05-07
				《晶体振荡器通用规范》 GJB 1648A-2011 3.6.44	只测： 容积≤0.35m³ 温度范围：-60℃~+200℃ 转换时间<5min;	2020-05-07
		4	温度循环	《电子产品环境应力筛选方法》 GJB 1032-1990 方法 5.1	只测：容积≤3.3m³ 温度范	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 19 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》 GB/T 2423.22-2012	围：-65℃~+150℃ 温度变化≤5℃/min 只测：Na、Nb 容积≤3.3m³ 温度范围：-55℃~+100℃ 温度变化率≤5℃/min	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 1051	只测：容积≤0.35m³，温度范围：-65℃~+150℃	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 1010.1	只测：容积≤0.35m³，温度范围：-65℃~+150℃	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB548A-1996 方法 1010A	只测：容积≤0.35m³ 温度范围：-60℃~+200℃ 转换时间<5min；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB548B-2005 方法 1010.1	只测：容积≤0.35m³ 温度范围：-60℃~+200℃	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 20 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					℃ 转换时间<5min	
		5	温度冲击试验（液态）	《微电子器件试验方法和程序》 GJB548B-2005 方法 1011.1	只测：条件 A、B、C 容积≤0.003m³ 温度范围：-65℃~+150℃	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 107	只测： 容积≤0.003m³ 温度范围：（-65~+150）℃	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 1056	只测：条件 A、B、C 容积≤0.003m³ 温度范围：-65℃~+150℃	2020-05-07
		6	耐湿试验	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 106	只测： 容积≤15m³ 温度范围：常温~+85℃ 湿度范围：（50%~95%）RH； 针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 106	只测：	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 21 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +85^\circ\text{C}$ 湿度范围： (50%~95%) RH	
				《电工电子产品环境试验第2部分：》 GB/T 2423.4-2008	只测： 容积 $\leq 15\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +85^\circ\text{C}$ 湿度范围： (50%~95%) RH；	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 1021	只测： 容积 $\leq 3.3\text{m}^3$ 温度范围：常 温 $\sim +85^\circ\text{C}$ 湿度范围： (50%~95%) RH	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 1004A	只测：容积 $\leq 3.3\text{m}^3$ 温度范围：常温 $\sim +85^\circ\text{C}$ 湿度范围： (50%~95%) RH；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法	只测：容积 \leq	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	中国合格评定国家认可委员会 稳态湿热	1004.1	3.3m ³ 温度范围： 常温~+85℃ 湿度 范围：（50%~ 95%）RH	
				认可证书附件 《过载传感器通用规范》 GJB5440-2005 3.5.7	只测：容积≤15m ³ 温度范围：常 温~+85℃ 湿度 范围：（50%~ 95%）RH	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 103	只测： 容积≤15m ³ 温度范围：常 温~+85℃ 湿度范围： （50%~95%） RH； 针对特定用户、 特定产品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 103	只测：容积≤15m ³ 温度范围：常 温~+85℃ 湿度 范围：（50%~ 95%）RH	2020-05-07
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热》 GB/T 2423.50-2012	只测： 容积≤15m ³ 温度范围：常	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	盐雾试验	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 101	温 \sim +85℃ 湿度范围： (50%~95%) RH 只测：容积 \leq 1.2m ³ ；温度范围：35 ℃ \pm 2℃； 盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 101	只测：容积 \leq 1.2m ³ ；温度范围：35 ℃ \pm 2℃； 盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h	2020-05-07
				《电工电子产品环境试验》 GB/T 2423.17-2008	只测：容积 \leq 1.2m ³ ；温度范围：35 ℃ \pm 2℃； 盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 24 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 1009A	只测：容积 $\leq 1.2\text{m}^3$ ； 温度范围： $35^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ ； 盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 1009.2	只测：容积 $\leq 1.2\text{m}^3$ ； 温度范围： $35^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ ； 盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h	2020-05-07
				《过载传感器通用规范》 GJB5440-2005 3.5.9	只测：容积 $\leq 1.2\text{m}^3$ ； 温度范围： $35^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ ； 盐雾沉降量： (1~3) ml/80cm ² ·h	2020-05-07
		9	低气压试验	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 105	只测：条款 D、E，容积 $\Phi 1000\text{mm} \times 1200\text{mm}$ ，压力范围：(10~	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 25 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1000)Pa; 针对特定用户、特定产品	
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 105	只测: $\Phi 1000\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 压力范围: 常压~1000Pa (常温)	2020-05-07
				《电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法》 GB/T 2423.21-2008	只测: 容积: $\Phi 1000\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 压力范围: 常压~1000Pa (常温);	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 1001	只测: $\Phi 1000\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 压力范围: 常压~1000Pa (常温)	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 1001	只测: $\Phi 1000\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 压力范围: 常压~1000Pa (常温) (针对特定用户、特定产品)	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 1001	只测: $\Phi 1000\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 压力范围: 常压~1000Pa (常温)	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 26 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《过载传感器通用规范》 GJB5440-2005 3.5.8	只测：Φ1000mm ×1200mm，压力 范围：常压～ 1000Pa（常温）	2020-05-07
		10	振动试验	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 201、214	只测：最大推 力：1000kN；最 大加速度： 500m/s ² ；最大位 移：76mm；最大 速度：2m/s；频 率范围：5Hz～ 2000Hz；针对特 定用户、特定产 品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 201、方法 214	只测：表 214-1、 214-2， 最大推 力：1000kN；最 大加速度： 500m/s ² ；最大位 移：76mm；最大 速度：2m/s；频 率范围：5Hz～ 2000Hz；	2020-05-07
				《电工电子产品环境试验》 GB/T 2423.10-2019	只测：最大推 力：1000kN；最 大加速度：	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2056	只测：最大推力：1000kN；最大加速度：500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2026 方法 2007	只测：方法 2026 试验条件 1 A-G 试验条件 2 A-F、方法 2007 中条件 A 最大推力：1000kN；最大加速度：500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz；针对特定用户、特定产	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 28 页 共 45 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					品	
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2026.1 方法 2007	只测：试验条件 1 A-G 试验条件 2 A-F、方法 2007 条件 A 最大推力：1000kN；最大加速度：500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	2020-05-07
				《过载传感器通用规范》 GJB5440-2005 3.5.4	只测：最大推力：1000kN；最大加速度：500m/s ² ；最大位移：76mm；最大速度：2m/s；频率范围：5Hz～2000Hz	2020-05-07
				《晶体振荡器通用规范》 GJB 1648A-2011 3.6.38	只测：最大推力：1000kN；最大加速度：500m/s ² ；最大位移：	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 29 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会		76mm; 最大速度: 2m/s; 频率范围: 5Hz~2000Hz	
		11	冲击	认可证书附件 《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 207、方法 213	只测: 最大推力: 500kN; 最大加速度: 5000m/s ² ; 脉冲持续时间: (0.5~11) ms; 针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-1996 方法 207、方法 213	只测: 最大推力: 500kN; 最大加速度: 5000m/s ² ; 脉冲持续时间: (0.5~11) ms	2020-05-07
				《电工电子产品环境试验》 GB/T 2423. 5-2019	只测: 最大推力: 500kN; 最大加速度: 5000m/s ² ; 脉冲持续时间: (0.5~11) ms	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2016	只测: 最大推力: 500kN; 最大加速度: 5000m/s	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 30 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2002A	² ；脉冲持续时间：（0.5~11）ms 只测：试验条件 A、A1；最大推力：500kN；最大加速度：5000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.5~11）ms	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-1996 方法 2002.1	只测：试验条件 A、B、最大推力：500kN；最大加速度：5000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.5~11）ms；	2020-05-07
				《过载传感器通用规范》 GJB 5440-2005 3.5.5	只测：试验条件 A、B、最大推力：500kN；最大加速度：5000m/s ² ；脉冲持续时间：（0.5~11）ms；	2020-05-07
				《晶体振荡器通用规范》 GJB 1648A-2011 3.6.40	只测：试验条件 A、B、最大推	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 31 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会	认可证书附件	力：500kN；最大加速度：5000m/s ² ；脉冲持续时间：(0.5~11)ms；	
		12	恒定加速度	《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2006	只测：载荷 ≤ 0.4kg，加速度范围：(5000~400000)m/s ²	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 212	只测：试验条件 B 载荷 ≤ 0.4kg，加速度范围：(5000~400000)m/s ² ；针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 212	只测：试验条件 B 总载荷：0.4kg，加速度范围：5000~400000m/s ²	2020-05-07
				《电工电子产品环境试验》 GB/T 2423.15-2008	只测：总载荷：0.4kg，加速度范围：5000~400000m/s ²	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2001A	只测：试验条件 A、B、C、D、E 载	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2001.1	荷 $\leq 0.4\text{kg}$ ，加速度范围：(5000~400000) m/s^2 针对特定用户、特定产品	
3	固定电阻器	1	直流电阻	《片式膜固定电阻器通用规范》 GJB 1432B-2009 4.5.2	只测： 电阻： 0~100M Ω	2020-05-07
4	固定电容器	1	电容量	《高可靠瓷介固定电容器通用规范》 GJB 4157A-2011 4.6.7	只测： 电容量： 1pF~100 μF	2020-05-07
				《电子设备用固定电容器 第1部分 总规范》 GB/T 2693-2001 4.7	只测： 电容量： 1pF~100 μF	2020-05-07
		2	损耗角正切	《高可靠瓷介固定电容器通用规范》 GJB 4157A-2011 4.6.8		2020-05-07
				《电子设备用固定电容器 第1部分 总规范》 GB/T 2693-2001 4.8		2020-05-07
		3	绝缘电阻	《高可靠瓷介固定电容器通用规范》 GJB 4157A-2011 4.6.10		2020-05-07



No. CNAS L11884

第 33 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电子设备用固定电容器 第1部分 总规范》 GB/T 2693-2001 4.5		2020-05-07
		4	介质耐电压	《高可靠瓷介固定电容器通用规范》 GJB 4157A-2011 4.6.9		2020-05-07
				《电子设备用固定电容器 第1部分 总规范》 GB/T 2693-2001 4.6		2020-05-07
5	钽电容	1	电容量	《电子设备用固定电容器 第3部分：分规范 表面安装 MnO ₂ 固体电解质钽固定电容器》 GB/T 6346.3-2015 4.5.2	只测： 电容量： 1pF~100 μF	2020-05-07
				《有可靠性指标的固体电解质钽电容器详细规范》 GJB 63B-2001 4.7.7	只测： 电容量： 1pF~100 μF	2020-05-07
		2	损耗角正切	《电子设备用固定电容器 第3部分：分规范 表面安装 MnO ₂ 固体电解质钽固定电容器》 GB/T 6346.3-2015 4.5.3		2020-05-07
				《有可靠性指标的固体电解质钽电容器详细规范》 GJB 63B-2001 4.7.8		2020-05-07
		3	漏电流	《电子设备用固定电容器 第3部分：分规范 表面安装 MnO ₂ 固体电解质钽固定电容器》 GB/T 6346.3-2015 4.5.1	只测： 漏电流：1 μA~20mA	2020-05-07
				《有可靠性指标的固体电解质钽电容器详细规范》 GJB 63B-2001 4.7.6	只测： 漏电流：1 μA~20mA	2020-05-07
6	固定电感器	1	电感	《射频固定和可变片式电感器通用规范》 GJB 1864A-2011 4.5.8.2	只测： 电感量： 频率 4Hz~8MHz	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	品质因数	《射频固定和可变片式电感器通用规范》 GJB 1864A-2011 4.5.8.3		2020-05-07
7	连接器	1	介质耐电压	《电连接器试验方法》 GJB 1217A-2009 方法 3001		2020-05-07
		2	绝缘电阻	《电连接器试验方法》 方法 GJB 1217A-2009 3003		2020-05-07
		3	电压驻波比	《微波元器件性能测试方法》 GJB2650-96 方法 1001	只测：1MHz～20GHz	2020-05-07
		4	插入损失（插入损耗）	《微波元器件性能测试方法》 GJB2650-96 方法 1002	只测：1MHz～20GHz	2020-05-07
8	滤波器	1	电压驻波比	《微波元器件性能测试方法》 GJB2650-96 方法 1001	只测：1MHz～20GHz	2020-05-07
		2	插入损失（插入损耗）	《微波元器件性能测试方法》 GJB2650-96 方法 1002	只测：1MHz～20GHz	2020-05-07
		3	群时延	《微波元器件性能测试方法》 GJB2650-96 方法 1008	只测：1MHz～20GHz	2020-05-07
		4	时延	《微波元器件性能测试方法》 GJB2650-96 方法 1009	只测：1MHz～20GHz	2020-05-07
		5	通带宽度、通带插损、阻带衰减	《微波元器件性能测试方法》 GJB2650-96 方法 1013	只测：1MHz～20GHz 仅测阻带衰减和通带宽带	2020-05-07
9	二极管	1	正向电压	《半导体器件分立器件和集成电路 第2部分：整流二极管》 GB/T 4023-2015 3.2.1	只测： 电压： -2000V～2000V 电流： - 40A～40A	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《半导体器件分立器件 第3部分：信号（包括开关）和调整二极管》 GB/T 6571-1995	只测： 电压： -2000V~2000V 电流： - 40A~40A	2020-05-07
		2	反向电流	《半导体器件分立器件和集成电路 第2部分：整流二极管》 GB/T 4023-2015 3.3.7	只测： 电压： -2000V~2000V 电流： - 40A~40A	2020-05-07
				《半导体器件分立器件 第3部分：信号（包括开关）和调整二极管》 GB/T 6571-1995	只测： 电压： -2000V~2000V 电流： - 40A~40A	2020-05-07
10	双极型晶体管	1	集电极-基极截止电流	《半导体分立器件和集成电路第七部分：双极型晶体管》 GB/T 4587-1994	只测： 电压： -2000V~2000V 电流： -40A~40A 热阻测试电流： 0~50A 热阻测试电压： 0~30V	2020-05-07
		2	集电极-发射极截止电流	《半导体分立器件和集成电路第七部分：双极型晶体管》 GB/T 4587-1994	只测： 电压：	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	-2000V~2000V 电流： -40A~40A 热阻测试电流： 0~50A 热阻测试电压： 0~30V	
		3	共发射极正向 电流传输比的 静态值	《半导体分立器件和集成电路第七部分：双极型晶体管》 GB/T 4587-1994	只测： 电压： -2000V~2000V 电流： -40A~40A 热阻测试电流： 0~50A 热阻测试电压： 0~30V	2020-05-07
		4	发射极-基极截 止电流	《半导体分立器件和集成电路第七部分：双极型晶体管》 GB/T 4587-1994	只测： 电压： -2000V~2000V 电流： -40A~40A 热阻测试电流： 0~50A 热阻测试电压： 0~30V	2020-05-07
		5	集电极-发射极	《半导体分立器件和集成电路第七部分：双极型晶体管》 GB/T 4587-1994	只测：	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			饱和电压	管》GB/T 4587-1994	电压： -2000V~2000V 电流： -40A~40A 热阻测试电流： 0~50A 热阻测试电压： 0~30V	
		6	基极-发射极饱和电压	《半导体分立器件和集成电路第七部分：双极型晶体管》GB/T 4587-1994	只测： 电压： -2000V~2000V 电流： -40A~40A 热阻测试电流： 0~50A 热阻测试电压： 0~30V	2020-05-07
11	电子元器件 （破坏性物理分析）	1	制样镜检	《军用电子元器件破坏性物理分析方法》GJB 4027A-2006	只做： 0103 片式固定电阻器、0201 圆片瓷介电容器、0601 低频电连接器	2020-05-07
		2	外部目检	《军用电子元器件破坏性物理分析方法》GJB 4027A-2006	只做： 0103 片式固定电阻器、0201 圆片	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		瓷介电容器、0601 低频电连接器、1003 表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管	
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2071		2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2009A	针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2009.1		2020-05-07
		3	粒子碰撞噪声检测	《军用电子元器件破坏性物理分析方法》 GJB 4027A-2006 1003 中的 2.5	只做： 1003 表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2052	只测： 声表面波器件、金属、陶瓷封装的器件。	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 217	只测： 声表面波器件、金属、陶瓷封装的器件。针对特定用户、特定产品	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 39 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 217	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷封装 的器件。	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2020A	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷封装 的器件。针对特 定用户、特定产 品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2020.1	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷封装 的器件。	2020-05-07
		4	密封	《军用电子元器件破坏性物理分析方法》 GJB 4027A-2006	只做： 0601 低频电连接 器、1003 表面安 装和外引线同向 引出晶体管、二 极管	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 1071	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷封装 的器件。	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 112	针对特定用户、 特定产品	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 112	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷和塑 料封装的器件。	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 1014A	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷封装 的器件。针对特 定用户、特定产 品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 1014.2	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷封装 的器件。	2020-05-07
		5	内部目检	《军用电子元器件破坏性物理分析方法》 GJB 4027A-2006	只做： 0201 圆片瓷介电 容器、1003 表面 安装和外引线同 向引出晶体管、 二极管	2020-05-07
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2074、方法 2072	只测： 声表面波器件、 金属、陶瓷装的 器件。	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2010A、方法 2017A	只测： 声表面波器件、	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					金属、陶瓷封装的器件。针对特定用户、特定产品	
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2010.1、方法 2014	只测： 声表面波器件、金属、陶瓷封装的器件。	2020-05-07
				《军用电子元器件破坏性物理分析方法》 GJB 4027A-2006 1003 中的 2.9	只做： 1003 表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管	2020-05-07
		6	键合强度	《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2037	只测： 半导体分立器件中晶体管与有键合引线二极管、金属、陶瓷封装的器件。	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2011A	只测： 声表面波器件、金属、陶瓷封装的器件。针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2011.1	只测： 半导体分立器件	2020-05-07



No. CNAS L11884

第 42 页 共 45 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会		中晶体管与有键合引线二极管、金属、陶瓷封装的器件。	
		7	芯片剪切强度	《军用电子元器件破坏性物理分析方法》 GJB 4027A-2006 1003 中的 2.11	只做： 1003 表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2019A	只测： 声表面波器件、金属、陶瓷封装的器件。针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2019.2	只测： 半导体分立器件中晶体管与有键合引线二极管、金属、陶瓷封装的器件。	2020-05-07
		8	物理尺寸	《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2036	接触性测量：0-150mm，精度：0.1mm；	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2016	接触性测量：0-150mm，精度：0.1mm；针对特定	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用户、特定产品	
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2016	接触性测量：0-150mm，精度：0.1mm；	2020-05-07
		9	引出端强度	《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2004.2	砝码：（10-2500）g；最大不确定度：0.1g	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360A-1996 方法 211	砝码：（10-2500）g；最大不确定度：0.1g。针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《电子及电气元件试验方法》 GJB 360B-2009 方法 211	砝码：（10-2500）g；最大不确定度：0.1g	2020-05-07
		10	超声显微镜检查	《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548A-1996 方法 2030	扫描频率：50MHz 最大扫描速度：1000mm/s 针对特定用户、特定产品	2020-05-07
				《微电子器件试验方法和程序》 GJB 548B-2005 方法 2030	扫描频率：50MHz 最大扫描速度：1000mm/s	2020-05-07
				《军用电子元器件破坏性物理分析方法》 GJB 4027A-2006 2.4	扫描频率：50MHz 最大扫描速度：	2020-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1000mm/s	
				《半导体分立器件试验方法》 GJB 128A-1997 方法 2077	扫描频率：50MHz 最大扫描速度： 1000mm/s	2020-05-07

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

No. CNAS L11884